Теперь
123 эВ (Mn Kα) при
100 000 имп/с

SDD детектор XFlash®5010



Компания Bruker AXS Microanalysis GmbH представляет новое поколение кремниевых дрейфовых детекторов - XFlash®5010. Как и все детекторы типа XFlash®, он не требует охлаждения жидким азотом. XFlash®5010 пятого поколения с двухступенчатым охлаждением на основе эффекта Пельтье позволяет проводить анализы в десять раз быстрее по сравнению с обычными Si(Li) детекторами.

Кремниевый чип детектора XFlash®5010 представляет собой твердотельную дрейфовую камеру. Особая конструкция чипа со встроенным полевым транзистором (FET), а также малые размеры анода впервые позволяют достигать энергетического разрешения 123 эВ на линии MnKα, что превосходит характеристики лучших Si(Li) детекторов. Благодаря специально разработанному гибридному процессору кремниевый дрейфовый детектор XFlash® 5010 стабильно поддерживает высокое разрешение в 123 эВ даже при скорости счета в 100 000 имп/с (MnKα).

Низкая емкость чипа обуславливает очень короткое время формирования импульса, позволяющее детектору работать с высокой скоростью счета (до 750 000 имп/с). Тем самым, например, рентгеновское картирование на электронном микроскопе занимает в 10 раз меньше времени в сравнении с обычными EDS системами. Такие уникальные характеристики открывают новые аналитические возможности для микроанализа: спектрометрия в реальном времени, функции HyperMap (Spectral Imaging/PTS) и ColorScan.

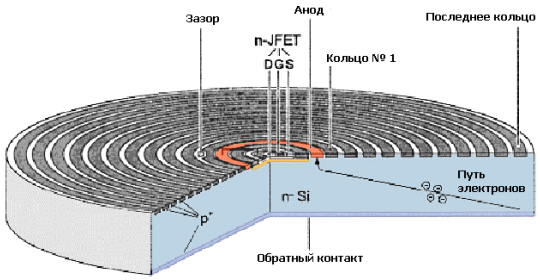
С помощью детектора XFlash® 5010 можно анализировать весь диапазон элементов от бериллия до америция.

XFlash®5010 готов к работе сразу же после включения. Он прост в эксплуатации и не требует никакого дополнительного обслуживания, что существенно экономит время пользователя. Отсутствие движущихся частей в детекторе позволяет получать на электронном микроскопе изображения без каких-либо искажений.

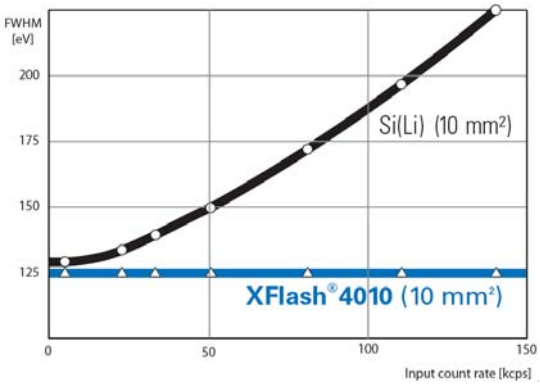
Детектор XFlash® 5010

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЕТЕКТОРА
Не требует охлаждения жидким азотом и дополнительного обслуживания
Энергетическое разрешение в 123 эВ (MnKα) гарантируется при 100 000 имп/с, на линии C Kα - 46 эВ, на линии F Kα - 53 эВ стабильно во всем диапазоне скоростей счета
Не требует защиты от образования льда и загрязнений, препятствующих детектированию легких элементов
Быстродействие в 10 раз выше по сравнению с Si(Li) детекторами
Анализ от бериллия (4) до америция (95)
Отсутствие вибрации и микрофонного эффекта
Активная площадь детектора 10 мм^2
Вес ~ 2,5 кг
Совместим со всеми типами растровых электронных микроскопов

Сравнение Si(Li) детектора / XFlash® детектора 4010



Конструкция чипа SDD кремниевого дрейфового детектора 2-го поколения



Энергетическое разрешение в зависимости от скорости счета импульсов на линии Mn Kα

Компания **Bruker** – один из крупнейших мировых производителей аналитического оборудования. **Bruker AXS** (до 1998 года рентгеновское подразделение концерна **SIEMENS**) имеет многолетний опыт и традиции создания рентгеновского оборудования от первых рентгеновских трубок и спектрометров.

Компания **Мелитэк** – эксклюзивный дистрибьютор в России рентгеновских систем фирмы **Bruker AXS**. Сервис, поддержку и методическое обучение в России и странах СНГ осуществляют российские специалисты компании **ООО Брукер** и **ООО Мелитэк.**

www.melytec.ru
www.bruker.ru
www.bruker-axs.de

ООО Мелитэк

117342, Москва,
ул. Обручева, д.34/63 корп. 2,
тел/факс: (495) 781-07-85
info@melytec.ru

Филиал ООО Мелитэк

192012, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 120
лит. Б, офис 150
тел./факс +1 (812) 380-84-85
infospb@melytec.ru